PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-327925

(43)Date of publication of application: 19.11.2003

(51)Int.Cl.

C09J 7/00 C09J135/00 C09J163/00 C09J171/02 C09J179/08 H01L 21/301 H01L 21/52

(21)Application number: 2002-137293

(22)Date of filing:

13.05.2002

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(72)Inventor: MASUKO TAKASHI

OKUBO KEISUKE KAWAKAMI HIROYUKI

INADA TEIICHI

(54) ADHESIVE SHEET, SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prepare an adhesive sheet acting as a dicing tape in a dicing process, and excellent in the reliability of joining in a joining process of a semiconductor element with a support member. SOLUTION: The adhesive sheet is equipped with an adhesive layer containing (A) a thermoplastic resin, (B) a thermosetting resin and (C) a compound exhibiting a curing property by an irradiation with a radiation.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

05.01.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2003-327925 (P2003-327925A)

(43)公開日 平成15年11月19日(2003.11.19)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)	
C 0 9 J 7/00	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	C09J 7/00	4J004	
135/00		135/00	4 J O 4 O 5 F O 4 7	
163/00		163/00		
171/02		171/02		
		179/08	Z	
179/08	審査請求		(全 15 頁) 最終頁に続く	
(21)出願番号	特顧2002-137293(P2002-137293)	(71) 出願人 000004455		
		日立化成工第		
(22)出願日	平成14年5月13日(2002.5.13)		【西新宿2丁目1番1号	
		(72)発明者 增子 崇	A STATE OF THE STA	
			省市和台48 日立化成工業株式	
		会社総合研究		
		(72) 発明者 大久保 恵力		
			省市和台48 日立化成工業株式	
		会社総合研究	究所内	
		(74)代理人 100083806		
		弁理士 三切	牙 秀和 (外7名)	
			最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 接着シートならびに半導体装置およびその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 ダイシング工程ではダイシングテープとして作用し、半導体素子と支持部材との接合工程では接続信頼性に優れる接着シートを提供する。

【解決手段】 (A) 熱可塑性樹脂、(B) 熱硬化性樹脂及び(C) 放射線照射によって硬化性を発現する化合物を含有する粘接着剤層を備えたことを特徴とする接着シート。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A) 熱可塑性樹脂、(B) 熱硬化性樹

1

【讀求項2】 前記(C)放射線照射によって硬化性を 発現する化合物がマレイミド誘導体である請求項1記載*

脂及び(C)放射線照射によって硬化性を発現する化合 物を含有する粘接着剤層を有する接着シート。

(式中、Rは炭素数1~10のアルキル基、n=1~1 0)

【請求項4】 前記ポリエーテル系ビスマレイミド酢酸 エステルの数平均分子量が1000以下である請求項3 に記載の接着シート。

【請求項5】 前記(B)熱硬化性樹脂がエポキシ樹脂 およびエポキシ樹脂硬化剤である請求項1~4のいずれ 20 かに記載の接着シート。

【請求項6】 前記(A)熱可塑性樹脂がポリイミド樹 脂である請求項1~5のいずれかに記載の接着シート。

【請求項7】 前記(A)熱可塑性樹脂が官能性モノマ 一を含む重量平均分子量が10万以上である高分子量成 分である請求項1~5のいずれかに記載の接着シート。

【請求項8】 前記官能性モノマーを含む重量平均分子 量が10万以上である高分子量成分が、エポキシ基含有 反復単位を0.5~6重量%含有するエポキシ基含有

(メタ) アクリル共重合体である請求項7に記載の接着 シート。

【請求項9】 前記粘接着剤層が、前記ポリイミド樹脂 を100重量部、前記エポキシ樹脂およびエポキシ樹脂 硬化剤を1~200重量部、及び前記ポリエーテル系ピ スマレイミド酢酸エステルを 0. 1~200 重量部含有 する請求項6に記載の接着シート。

【請求項10】 前記粘接着剤層が、前記エポキシ樹脂 およびエポキシ樹脂硬化剤を100重量部、前記官能性 モノマーを含む重量平均分子量が10万以上である高分 子量成分を10~400重量部、及び前記ポリエーテル 40 系ビスマレイミド酢酸エステルを0.1~200重量部 含有する請求項7に記載の接着シート。

【請求項11】 前記接着剤層が、25℃で10~20 00MPa、および260℃で3~50MPaの加熱硬 化後の貯蔵弾性率を有する請求項10に記載の接着シー ١.

【請求項12】 さらに、基材を有する請求項1~11 に記載の接着 シート。

【請求項13】 前記粘接着剤層と前記基材との間の接 着力が放射線の照射により制御されるものである請求項※50

【請求項3】 前記 (C) 放射線照射によって硬化性を 発現する化合物が下記式 (1) で示されるポリエーテル 系ビスマレイミド酢酸エステルである請求項2に記載の

2

接着シート。

* の接着シート。

※12に記載の接着シート。

【請求項14】 請求項1~13のいずれか1項に記載 の接着シートを用いて半導体素子と半導体搭載用支持部 材とを接着した半導体装置。

【請求項15】 (a)請求項12又は13に記載の粘 接着剤層と基材層とを有する接着シートを、前記粘接着 剤層を挟んで半導体ウェハ上に設けることにより接着シ ート付き半導体ウェハを得る工程と、(b)前記接着シ ート付きウェハをダイシングして接着シート付き半導体 素子を得る工程と、(c) 前記接着シートに放射線を照 射して前記粘接着剤層の前記基材層に対する接着力を低 減し、かつ前記基材層を剥離して粘接着剤層付き半導体 素子を得る工程と、(d)前記粘接着剤層付き半導体素 子と半導体素子搭載用の支持部材とを前記粘接着剤層を 介して接着する工程と、を含む半導体装置の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[0002]

【発明の属する技術分野】本発明は、接着シート、それ を使用した半導体装置およびその製造方法に関する。

【従来の技術】従来、半導体素子と半導体素子搭載用支 持部材の接合には銀ペーストが主に使用されていた。し かし、近年の半導体素子の小型化・高性能化に伴い、使 用される支持部材にも小型化・細密化が要求されるよう になってきている。こうした要求に対して、銀ペースト では、はみ出しや半導体素子の傾きに起因するワイヤボ ンディング時における不具合の発生、接着剤層の膜厚の 制御困難性、および接着剤層のボイド発生などにより前 記要求に対処しきれなくなってきている。そのため、前 記要求に対処するべく、近年、フィルム状の接着剤が使 用されるようになってきた。

【0003】このフィルム状接着剤は、個片貼付け方式 あるいはウェハ裏面貼付け方式において使用されてい る。前者の個片貼付け方式のフィルム状接着剤を用いて 半導体装置を製造する場合、リール状の接着フィルムを カッティングあるいはパンチングによって個片に切り出 した後その個片を支持部材に接着し;前記フィルム状接

着剤付き支持部材にダイシング工程によって個片化され た半導体索子を接合して半導体索子付き支持部材を作製 し;その後必要に応じてワイヤボンド工程、封止工程な どを経ることによって半導体装置が得られることとな る。しかし、前記個片貼付け方式のフィルム状接着剤を 用いるためには、接着フィルムを切り出して支持部材に 接着する専用の組立装置が必要であることから、銀ペー ストを使用する方法に比べて製造コストが高くなるとい う問題があった。一方、後者のウェハ裏面貼付け方式の フィルム状接着剤を用いて半導体装置を製造する場合、 まず半導体ウェハの裏面にフィルム状接着剤を貼付けさ らにフィルム状接着剤の他面にダイシングテープを貼り 合わせ; その後前記ウェハからダイシングによって半導 体素子を個片化し; 個片化したフィルム状接着剤付き半 導体素子をピックアップしそれを支持部材に接合し:そ の後の加熱、硬化、ワイヤボンドなどの工程を経ること により半導体装置が得られることとなる。このウェハ塞 面貼付け方式のフィルム状接着剤は、フィルム状接着剤 付き半導体索子を支持部材に接合するためフィルム状接 着剤を個片化する装置を必要とせず、従来の銀ペースト 20 用の組立装置をそのままあるいは熱盤を付加するなどの 装置の一部を改良することにより使用できる。そのた め、フィルム状接着剤を用いた組立方法の中で製造コス トが比較的安く抑えられる方法として注目されている。 【0004】このウェハ裏面貼付け方式のフィルム状接 着剤と共に用いられるダイシングテープは、 感圧型と U V型ダイシングテープに大別される。前者の感圧型ダイ シングテープは、通常、ポリ塩化ビニル系やポリオレフ ィン系のベースフィルムに粘着剤を塗布したものであ る。このダイシングテープは、ダイシング工程における 30 切断時にはダイシングソウによる回転で各案子が飛散し ないような十分な粘着力が求められ、ピックアップ時に は各素子に接着剤が付着することなくまた素子を傷つけ ないようにするためにピックアップできる程度の低い粘 着力が求められる。ところが、前記のような相反する2 つの性能を充分併せ持つ感圧型ダイシングテープがなか ったことより、各工程毎にダイシングテープを切替える 作業が行われていた。また素子のサイズや加工条件にあ った各種の粘着力を有する多種多様のダイシングテープ が必要になることから接着シートの在庫管理が複雑化し ていた。さらに、近年、特にCPUやメモリの大容量化 が進んだ結果半導体素子が大型化する傾向にあり、また ICカードあるいはメモリーカードなどの製品にあって*

* は使用されるメモリの薄型化が進んでいる。これらの半 導体案子の大型化や薄型化に伴い、前記感圧型ダイシン グテープでは、ダイシング時の固定力(高粘着力)とピ ックアップ時の剥離力(低粘着力)という相反する要求 を満足できなくなりつつある。一方、後者のUV型ダイ シングテープはダイシング時には高粘着力を有するもの の、ピックアップする前に紫外線 (UV) を照射するこ とにより低粘着力になる。そのため、前記感圧型テープ が有する課題が改善されることより、ダイシングテープ として広く採用されるに至っている。このUV型ダイシ ングテープを用いることにより前記感圧型ダイシングテ ープの課題は改善されるものの、ウェハ裏面貼付け方式 のフィルム状接着剤にはさらに改善すべき課題が残され ていた。即ち、ウェハ裏面貼付け方式のフィルム状接着 剤を用いる方法にあっては、前記ダイシング工程まで に、フィルム状接着剤とダイシングテープを貼付すると いった2つの貼付工程が必要であったことから、作業工 程の簡略化が求められていた。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記した従 来技術の問題に鑑み、ダイシング工程ではダイシングテ ープとして作用し、半導体素子と支持部材との接合工程 では接続信頼性に優れる接着シートを提供することを目 的とする。また、この接着シートは、半導体索子搭載用 支持部材に熱膨張係数の差が大きい半導体素子を実装す る場合に要求される耐熱性および耐湿性を有し、かつ作 業性に優れる接着シートである。本発明は、さらに、半 導体装置の製造工程を簡略化できる製造方法を提供する ことを目的とする。

[0006]

【問題を解決するための手段】本願は以下の発明に関す る.

- (A) 熱可塑性樹脂、(B) 熱硬化性樹脂及び (C) 放射線照射によって硬化性を発現する化合物を含 有する粘接着剤層を有する接着シート。
- 前記(C)放射線照射によって硬化性を発現する 化合物がマレイミド誘導体である前記1に記載の接着シ ート。
- 前記(C)放射線照射によって硬化性を発現する 3. 化合物が下記式(1)で示されるポリエーテル系ピスマ レイミド酢酸エステルである前記2に記載の接着シー ト。

【化2】

(式中、Rは炭素数 $1\sim10$ のアルキル基、 $n=1\sim1$ 0)

4. 前記ポリエーテル系ピスマレイミド酢酸エステルの数平均分子量が1000以下である前記3に記載の接着シート。

5. 前記(B) 熱硬化性樹脂がエポキシ樹脂およびエポキシ樹脂硬化剤である前記1~4のいずれかに記載の接着シート。

6. 前記(A)熱可塑性樹脂がポリイミド樹脂である前記1~5のいずれかに記載の接着シート。

7. 前記(A)熱可塑性樹脂が官能性モノマーを含む 重量平均分子量が10万以上である高分子量成分である 前記1~5のいずれかに記載の接着シート。

8. 前記官能性モノマーを含む重量平均分子量が10万以上である高分子量成分が、エポキシ基含有反復単位を0.5~6重量%含有するエポキシ基含有(メタ)アクリル共重合体である前記7に記載の接着シート。

9. 前記粘接着剤層が、前記ポリイミド樹脂を100 重量部、前記エポキシ樹脂およびエポキシ樹脂硬化剤を 1~200重量部、及び前記ポリエーテル系ビスマレイ ミド酢酸エステルを0.1~200重量部含有する前記 6に記載の接着シート。

10. 前記粘接着剤層が、前記エポキシ樹脂およびエポキシ樹脂硬化剤を100重量部、前記官能性モノマーを含む重量平均分子量が10万以上である高分子量成分を10~400重量部、及び前記ポリエーテル系ピスマレイミド酢酸エステルを0.1~200重量部含有する前記7に記載の接着シート。

11. 前記接着剤層が、25℃で10~2000MP a、および260℃で3~50MPaの加熱硬化後の貯 30 蔵弾性率を有する前記10に記載の接着シート。

12. さらに、基材を有する前記1~11に記載の接着シート。

13. 前記粘接着剤層と前記基材との間の接着力が放射線の照射により制御されるものである前記 12に記載の接着シート。

14. 前記1~13のいずれか1項に記載の接着シー*

*トを用いて半導体素子と半導体搭載用支持部材とを接着 した半導体装置。

15. (a) 前記12又は13に記載の粘接着剤層と基材層とを有する接着シートを前記粘接着剤層を挟んで半導体ウェハ上に設けることにより接着シート付き半導体ウェハを得る工程と、(b) 前記接着シート付きウェハをダイシングして接着シート付き半導体素子を得る工程と、(c) 前記接着シートに放射線を照射して前記粘接着剤層の前記基材層に対する接着力を低減し、かつ前記基材層を剥離して粘接着剤層付き半導体素子と半導体素子搭載用の支持部材とを前記粘接着剤層を介して接着する工程と、を含む半導体装置の製造方法。

[0007]

【発明の実施の形態】本発明の接着シートは、(A)熱 可塑性樹脂、(B) 熱硬化性樹脂及び(C) 放射線照射 によって硬化性を発現する化合物を含有する粘接着剤層 を備えたことを特徴とする。かかる構成を有することよ り、本発明の接着シートは、ダイシング工程ではダイシ ングテープとして作用し、半導体素子と支持部材との接 合工程では接続信頼性に優れる接着シートとして作用す ることとなる。言い換えると、本発明の接着シートを構 成する前記粘接着剤層は、ダイシング時には半導体素子 が飛散しない十分な粘着力を有し、かつ、放射線を照射 して前記粘接着剤層と基材との間の接着力を制御するこ とにより、ピックアップ時には各素子を傷つけることが ない低い粘着力を有するという相反する要求を満足する ものである。従って、本発明の接着シートを用いること で、ダイシングおよびダイボンドの各工程を、一枚の接 着シートで完了することができることとなる。

【0008】前記(C)放射線照射によって硬化性を発現する化合物とは、マレイミド誘導体であり、具体的には、下記式(1)で示されるポリエーテル系ピスマレイミド酢酸エステルであり、さらに具体的には数平均分子量が1000以下であることを特徴とする。

【化3】

HC
$$CH_2$$
 CH_2 CH_2 CH_3 CH_4 CH_5 CH_5 CH_6 CH_6 CH_7 CH_8 CH_8

(式中、Rは炭素数 $1 \sim 10$ のアルキル基、 $n=1 \sim 1$ 0)

【0009】前記式(1)中のRは、炭素数1~10の アルキル基であるが、より好ましくはCH₁ CH₂ CH₃ CH₃ である。炭素数が10を超えると、放射線照射後 のピックアップ時に各素子を傷つける傾向があり、好ま 50 しくない。 前記式 (1) 中のn数は $1\sim3$ 0であるが、好ましくは $1\sim1$ 0であり、より好ましくは $2\sim5$ である。n数が30を超えると、放射線照射後のピックアップ時に各素子を傷つける傾向があり、好ましくない。

【0010】前記ポリエーテル系ピスマレイミド酢酸エステルは、光開始剤の添加なしで、放射線照射時の良好

(5)

な硬化性を発現するが、硬化性の制御にあたっては、適 宜光開始剤を添加してもよい。放射線照射時の硬化性を 制御する目的で、前記ポリエーテル系ピスマレイミド酢 酸エステルと脂肪族アクリレートまたは芳香族アクリレ ートを組み合わせることもできる。上記硬化性を抑制す る場合は、芳香族アクリレートとの組み合わせが有効で ある。本発明の接着シートにおいて、使用する(B)熱 硬化性樹脂としては、熱によって重合あるいは架橋する 樹脂組成物であれば特に限定されるものではないが、好 ましくはエポキシ樹脂である。エポキシ樹脂は、硬化し 10 て接着作用を有するものであれば特に限定されない。ビ スフェノール A型(又はAD型、S型、F型)のグリシ ジルエーテル、水添加ビスフェノールA型のグリシジル エーテル、エチレンオキシド付加体ビスフェノールA型 のグリシジルエーテル、プロピレンオキシド付加体ビス フェノールA型のグリシジルエーテルなどの二官能エポ キシ樹脂、フェノールノポラック型グリシジルエーテル やクレゾールノボラック型グリシジルエーテルなどのノ ボラック型エポキシ樹脂、3官能型(又は4官能型)の グリシジルエーテル等の多官能エポキシ樹脂、ジシクロ 20 ペンタジエンフェノール樹脂のグリシジルエーテル等の 脂環式エポキシ樹脂、ダイマー酸のグリシジルエステ ル、3官能型(又は4官能型)のグリシジルアミン等の グリシジルアミン型エポキシ樹脂等、ナフタレン樹脂、 複素環含有エポキシ樹脂等、一般に知られているものを

適用することができる。

【0011】このようなエポキシ樹脂として、ビスフェ ノールA型エポキシ樹脂としては、油化シェルエポキシ (株) 製 エピコート807, 815, 825, 82 7, 828, 834, 1001, 1004, 1007, 1009、ダウケミカル社製DER-330, 301, 361、東都化成(株)製 YD8125, YDF81 70などが挙げられる。フェノールノボラック型エポキ シ樹脂としては、油化シェルエポキシ(株)製 エピコ ート152. 154、日本化薬 (株) 製 EPPN-2 01、ダウケミカル社製 DEN-438などが、ま た、o-クレゾールノボラック型エポキシ樹脂として は、日本化薬 (株) 製 EOCN-102S, 103 S, 104S, 1012, 1025, 1027、東都化 成(株) 製 YDCN701, 702, 703, 704 40 などが挙げられる。多官能エポキシ樹脂としては、油化 シェルエポキシ (株) 製 Epon 1031S、チバ スペシャリティーケミカルズ社製 アラルダイト016 3、ナガセ化成(株) 製 デナコールEX-611, 6 14, 614B, 622, 512, 521, 421, 4 11,321などが挙げられる。アミン型エポキシ樹脂 としては、油化シェルエポキシ(株)製 エピコート6 04、東都化成(株)製 YH-434、三菱ガス化学 (株) 製 TETRAD-X, TETRAD-C、住友 化学 (株) 製 ELM-120などが挙げられる。複素 50

環含有エポキシ樹脂としては、チバスペシャリティーケ ミカルズ社製 アラルダイトPT810等の、UCC社 製 ERL4234, 4299, 4221, 4206な どが挙げられる。これらのエポキシ樹脂は、単独でまた は2種類以上を組み合わせても、使用することができ

【0012】上記エポキシ樹脂の硬化剤としては、通常 用いられている公知の硬化剤を使用することができる。 たとえば、脂肪族アミン、脂環族アミン、芳香族ポリア ミン等のアミン類、ポリアミド、脂肪族酸無水物、脂環 族酸無水物、芳香族酸無水物等の酸無水物、ポリスルフ ィド、三フッ化ホウ素、ビスフェノールA、ビスフェノ ールF. ビスフェノールSのようなフェノール性水酸基 を1分子中に2個以上有するビスフェノール類、フェノ ールノボラック樹脂、ビスフェノールAノボラック樹脂 またはクレゾールノボラック樹脂などのフェノール系化 合物、ジシアンジアミド、有機酸ジヒドラジド、三フッ 化ホウ素アミン錯体、イミダゾール類、第3級アミン等 が挙げられ、などが挙げられる。特に吸湿時の耐電食性 に優れる点で、フェノールノボラック樹脂、ビスフェノ ールAノボラック樹脂またはクレゾールノボラック樹脂 などのフェノール系化合物が好ましい。

【0013】好ましいフェノール系化合物としては、フ ェノールノボラック樹脂、クレゾールノボラック樹脂、 t-ブチルフェノールノボラック樹脂、ジシクロペンタ ジェンクレゾールノボラック樹脂、ジシク ロペンタジェ ンフェノールノボラック樹脂、キシリレン変性フェノー ルノボラック樹脂、ナフトールノボラック 樹脂、トリス フェノールノボラック樹脂、テトラキスフェノールノボ ラック樹脂、ピスフェノールAノボラック樹脂、ポリー p – ビニル フェノール樹脂、フェノールア ラルキル樹脂 等が挙げられ、たとえば、大日本インキ化学工業(株) 製、商品名:フェノライトLF2882、フェノライト LF2822、フェノライトTD-2090、フェノラ イトTD-2149、フェノライトVH-4150、フ エノライトVH4170、本州化学(株)製TrisP - P A などが挙げられる。

【0014】本発明の接着シートにおいて、使用する (A) 熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリイミド樹 脂、ポリアミド樹脂、ポリエーテルイミド樹脂、ポリア ミドイミド樹脂、ポリエステル樹脂、ポリエステルイミ ド樹脂、フェノキシ樹脂、ポリスルホン樹脂、ポリエー テルスルホン樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂、 ポリエーテルケトン樹脂、官能性モノマーを含む重合体 等があるが、好ましいものは官能性モノマーを含む重合 体及びポリイミド樹脂である。

【0015】前記官能性モノマーを含む重合体として は、グリシジルアクリレートまたはグリシジルメタクリ レートなどの官能性モノマーを含有するエポキシ基含有 (メタ) アクリル共重合体などが好ましく、さらにエポ キシ樹脂等の熱硬化性樹脂と非相溶であることが好ましい

【0016】エボキシ基含有(メタ)アクリル共重合体は、たとえば、(メタ)アクリルエステル共重合体、アクリルゴムなどを使用することができ、アクリルゴムがより好ましい。アクリルゴムは、アクリル酸エステルを主成分とし、主として、ブチルアクリレートとアクリロニトリルなどの共重合体や、エチルアクリレートとアクリロニトリルなどの共重合体などからなるゴムである。【0017】官能性モノマーとしては、グリシジルアク10

【0017】官能性モノマーとしては、グリシジルアクリレートまたはグリシジルメタクリレートなどを使用することが好ましい。このようなエポキシ基含有(メタ)アクリル共重合体としては、たとえば、帝国化学産業(株)製HTR-860P-3などが挙げられる。

【0018】グリシジルアクリレートまたはグリシジルメタクリレートなどのエポキシ樹脂含有反復単位の量は、0.5~6.0重量%が好ましく、0.5~5.0 重量%がより好ましく、0.8~5.0重量%が特に好ましい。エポキシ基含有反復単位の量がこの範囲にあると、接着力が確保できるとともに、ゲル化を防止するこ 20とができる。

【0019】官能性モノマーとしては、グリシジルアクリレート、グリシジルメタクリレートのほかに、たとえば、エチル(メタ)アクリレート、ブチル(メタ)アクリレートなどが挙げられ、これらは、単独でまたは2種類以上を組み合わせて使用することもできる。なお、本発明において、エチル(メタ)アクリレートとは、エチルアクリレートとエチルメタクリレートの両方を示す。官能性モノマーを組み合わせて使用する場合の混合比率は、エポキシ基含有(メタ)アクリル共重合体のTgをは、エポキシ基含有(メタ)アクリル共重合体のTgをお慮して決定し、Tgは一50℃以上であることが好ましい。Tgが一50℃以上であると、Bステージ状態での粘接着剤層のタック性が適当であり、取り扱い性に問題を生じないからである。

【0020】上記モノマーを重合させて、官能性モノマーを含む重合体を製造する場合、その重合方法としては特に制限はなく、たとえば、パール重合、溶液重合などの方法を使用することができる。

【0021】また、ポリイミド樹脂としては、例えば、テトラカルボン酸二無水物とジアミンを公知の方法で縮合反応させて得ることができる。すなわち、有機溶媒中で、テトラカルボン酸二無水物とジアミンを等モル又ははぼ等モル用い(各成分の添加順序は任意)、反応温度80℃以下、好ましくは0~60℃で付加反応させる。用いる有機溶媒としては、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、Nーメチルー2ーピロリドン、ジメチルホルムアミド、ヘキサメチルホスホリルアミド、エークレゾール、ロークロルフェノール等がある。反応が進行するにつれ反応液の粘度が徐々に上昇し、ポリイミドの前駆体であるポリアミド酸が生成する。前記ポリ50

アミド酸は、 $50 \sim 80$ の温度で加熱して解重合させることによって、その分子量を調整する。

10

【0022】ポリイミド樹脂は、上記反応物(ポリアミ ド酸)を脱水閉環させて得ることができる。脱水閉環 は、120℃~250℃で加熱処理する熱閉環法と、脱 水剤を使用する化学閉環法で行うことができる。熱閉環 法の場合、脱水反応で生じる水を系外に除去しながら行 うことが好ましい。この際、ベンゼン、トルエン、キシ レン等を用いて水を共沸除去してもよい。化学的方法で 脱水閉環させる場合は、閉環剤として無水酢酸、無水プ ロピオン酸、無水安息香酸の酸無水物、ジシクロヘキシ ルカルボジイミド等のカルボジイミド化合物等を用い る。このとき必要に応じてピリジン、イソキノリン、ト リメチルアミン、アミノピリジン、イミダゾール等の閉 環触媒を用いてもよい。閉環剤又は閉環触媒は、テトラ カルボン酸二無水物1モルに対し、それぞれ1~8モル の範囲で使用するのが好ましい。なお、本発明において ポリイミド樹脂とは、ポリイミド及びその前駆体を総称 する。ポリイミドの前駆体には、ポリアミド酸のほか、 ポリアミド酸が部分的にイミド化したものがある。

【0023】ポリイミド樹脂の原料として用いられるテ トラカルボン酸二無水物としては特に制限は無く、例え ば、1,2-(エチレン) ビス(トリメリテート無水 物)、1、3-(トリメチレン)ビス(トリメリテート 無水物)、1,4-(テトラメチレン)ピス(トリメリ テート無水物)、1,5-(ペンタメチレン)ビス(ト リメリテート無水物)、1,6-(ヘキサメチレン)ビ ス(トリメリテート無水物)、1,7-(ヘプタメチレ ン) ビス (トリメリテート無水物)、1,8-(オクタ メチレン) ビス (トリメリテート無水物)、1,9-(ノナメチレン) ビス (トリメリテート無水物)、1, 10-(デカメチレン) ビス (トリメリテート無水 物)、1,12-(ドデカメチレン)ビス(トリメリテ ート無水物)、1,16-(ヘキサデカメチレン)ビス (トリメリテート無水物)、1,18-(オクタデカメ チレン) ビス(トリメリテート無水物)、ピロメリット 酸二無水物、3,3'、4,4'-ビフェニルテトラカ ルボン酸二無水物、2,2、3,3'-ビフェニルテ トラカルボン酸二無水物、2,2-ビス(3,4-ジカ ルボキシフェニル)プロパン二無水物、2,2-ビス (2, 3-ジカルボキシフェニル)プロパンニ無水物、 1, 1-ビス(2, 3-ジカルボキシフェニル) エタン 二無水物、1,1-ビス(3,4-ジカルポキシフェニ ル) エタンニ無水物、ビス(2,3-ジカルボキシフェ ニル)メタン二無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフ ェニル) メタン二無水物、ビス(3,4-ジカルポキシ フェニル)スルホン二無水物、3,4,9,10-ペリ レンテトラカルボン酸二無水物、ピス(3,4-ジカル ボキシフェニル) エーテル二無水物、ベンゼン-1, 2, 3, 4-テトラカルボン酸二無水物、3, 4,

(7)

3', 4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水 物、2,3,2',3'ーベンゾフェノンテトラカルボ ン酸二無水物、3,3,3,4'-ベンゾフェノンテ トラカルボン酸二無水物、1,2,5,6-ナフタレン テトラカルポン酸二無水物、1,4,5,8ーナフタレ ンテトラカルボン酸二無水物、2、3、6、7-ナフタ レンテトラカルボン酸二無水物、1,2,4,5-ナフ タレンテトラカルボン酸二無水物、2,6-ジクロロナ フタレン-1、4、5、8-テトラカルボン酸二無水 物、2,7-ジクロロナフタレン-1,4,5,8-テ 10 トラカルボン酸二無水物、2,3,6,7-テトラクロ ロナフタレン-1,4,5,8-テトラカルボン酸二無 水物、フェナンスレン-1,8,9,10-テトラカル ボン酸二無水物、ピラジン-2,3,5,6-テトラカ ルボン酸二無水物、チオフェン-2,3,5,6-テト ラカルボン酸二無水物、2,3,3',4'-ビフェニ ルテトラカルボン酸二無水物、3,4,3',4'-ビ フェニルテトラカルボン酸二無水物、2,3,2,, 3'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物、ビス (3, 4-ジカルボキシフェニル) ジメチルシラン二無 20 水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)メチルフ ェニルシラン二無水物、ビス(3、4-ジカルボキシフ ェニル) ジフェニルシラン二無水物、1,4-ビス (3, 4-ジカルボキシフェニルジメチルシリル)ベン ゼン二無水物、1,3-ビス(3,4-ジカルボキシフ ェニル) -1, 1, 3, 3-テトラメチルジシクロヘキ サン二無水物、p-フェニレンビス(トリメリテート無 水物)、エチレンテトラカルボン酸二無水物、1,2, 3,4-ブタンテトラカルボン酸二無水物、デカヒドロ ナフタレン-1.4.5.8-テトラカルボン酸二無水 30 物、4,8-ジメチル-1,2,3,5,6,7-ヘキ サヒドロナフタレン-1,2,5,6-テトラカルボン 酸二無水物、シクロペンタン-1,2,3,4-テトラ カルボン酸二無水物、ピロリジン-2,3,4,5-テ トラカルボン酸二無水物、1,2,3,4-シクロブタ ンテトラカルボン酸二無水物、ビス(エキソービシクロ [2, 2, 1] ヘプタン-2, 3-ジカルボン酸二無水 物、ビシクロー〔2、2、2〕ーオクトー7ーエンー 2, 3, 5, 6-テトラカルボン酸二無水物、2, 2-ビス (3, 4 - ジカルボキシフェニル) ヘキサフルオロ 40 プロパン二無水物、2,2,-ビス〔4-(3,4-ジ カルボキシフェニル)フェニル)ヘキサフルオロプロパ ン二無水物、4,4'-ビス(3,4-ジカルボキシフ ェノキシ)ジフェニルスルフィド二無水物、1,4-ビ ス(2-ヒドロキシヘキサフルオロイソプロピル)ベン ゼンビス (トリメリット酸無水物)、1,3-ビス(2 -ヒドロキシヘキサフルオロイソプロピル) ベンゼンビ ス(トリメリット酸無水物)、5-(2,5-ジオキソ テトラヒドロフリル) -3-メチル-3-シクロヘキセ

ン-2,3,4,5-テトラカルボン酸二無水物、4, 4 '- (4, 4' -イソプロピリデンジフェノキシ) ビ ス(フタル酸二無水物)等を使用することができ、これ らの1種または2種以上を併用することもできる。 【0024】また、ポリイミドの原料として用いられる ジアミンとしては特に制限は無く、例えば、oーフェニ レンジアミン、m-フェニレンジアミン、p-フェニレ ンジアミン、3,3'-ジアミノジフェニルエーテル、 3. 4'-ジアミノジフェニルエーテル、4,4'-ジ アミノジフェニルエーテル、3,3'-ジアミノジフェ ニルメタン、3、4'-ジアミノジフェニルメタン、 4.4'-ジアミノジフェニルエーテメタン、ビス(4 -アミノ-3、5-ジメチルフェニル)メタン、ビス (4-アミノ-3、5-ジイソプロピルフェニル) メタ ン、3,3~-ジアミノジフェニルジフルオロメタン、 3、4'-ジアミノジフェニルジフルオロメタン、4, 4'-ジアミノジフェニルジフルオロメタン、3,3' ージアミノジフェニルスルフォン、3,4'ージアミノ ジフェニルスルフォン、4,4'-ジアミノジフェニル スルフォン、3、3'-ジアミノジフェニルスルフィ ド、3,4'-ジアミノジフェニルスルフィド、4, 4'-ジアミノジフェニルスルフィド、3,3'-ジア ミノジフェニルケトン、3、4'ージアミノジフェニル ケトン、4,4'-ジアミノジフェニルケトン、2,2 ービス (3-アミノフェニル) プロパン、2,2'-(3, 4'-ジアミノジフェニル)プロパン、2,2-ビス (4-アミノフェニル) プロパン、2, 2-ビス (3-アミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2-(3,4'-ジアミノジフェニル)へキサフルオロ プロパン、2, 2-ビス(4-アミノフェニル)へキサ フルオロプロパン、1、3-ビス(3-アミノフェノキ シ)ベンゼン、1,4-ビス(3-アミノフェノキシ) ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベン ゼン、3, 3'-(1,4-フェニレンピス(1-メチ ルエチリデン)) ビスアニリン、3,4'-(1,4-フェニレンビス(1-メチルエチリデン))ビスアニリ ン、4,4'-(1,4-フェニレンピス(1-メチル エチリデン)) ビスアニリン、2,2-ビス(4-(3 -アミノフェノキシ)フェニル)プロパン、2,2-ビ ス (4-(4-アミノフェノキシ) フェニル) プロパ ン、2,2-ビス(4-(3-アミノフェノキシ)フェ ニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2-ビス(4-(4-アミノフェノキシ) フェニル) ヘキサフルオロプ ロパン、ビス(4-(3-アミノエノキシ)フェニル) スルフィド、ビス (4-(4-アミノエノキシ) フェニ ル) スルフィド、ビス (4-(3-アミノエノキシ) フ ェニル)スルフォン、ビス(4-(4-アミノエノキ シ) フェニル) スルフォン、3,5-ジアミノ安息香酸 等の芳香族ジアミン、1、2-ジアミノエタン、1、3 ン-1, 2-ジカルボン酸二無水物、テトラヒドロフラ 50 -ジアミノプロパン、1, 4-ジアミノブタン、1, 5

-ジアミノペンタン、1,6-ジアミノヘキサン、1,

7-ジアミノヘプタン、1、8-ジアミノオクタン、

1.9-ジアミノノナン、1,10-ジアミノデカン、

* デカン、1 , 2 - ジアミノシクロヘキサン、下記一般式

(2)

[0025]

1, 11-ジアミノウンデカン、1, 12-ジアミノド* 【化4】 **R**3 **R**3

$$H_2N-R_1$$
 $+ (S_1 - O) - (S_1 - R_2 - NH_2)$ $+ (S_1 - O) - (S_1 - R_2 - NH_2)$ $+ (S_1 - O) - (S_1 - R_2 - NH_2)$ $+ (S_1 - O) - (S_1 - NH_2)$ $+ (S_1 - NH$

【0026】(式中、R、及びR、は炭素原子数1~30の二価の炭化水素基を示し、それぞれ同一でも異なっていてもよく、R、及びR、は一価の炭化水素基を示し、それぞれ同一でも異なっていてもよく、mは1以上の整数である)で表されるジアミノポリシロキサン、1、3-ビス(アミノメチル)シクロヘキサン、サンテクノケミカル(株)製 ジェファーミン D-230,D-400,D-2001,ED-2001,ED-2001,ED-148等のポリオキシアルキレンジアミン等の脂肪族ジアミン等を使用することができ、これらの1種または2種以上を併用することもできる。

【0027】熱可塑性樹脂として、官能性モノマーを含む重合体を使用する場合は、エポキシ樹脂及びエポキシ樹脂硬化剤100重量部、官能性モノマーを含む重合体10~400重量部、及びポリエーテル系ビスマレイミド酢酸エステル0.1~200重量部である。この範囲にあると、弾性率および成型時のフロー性抑制が確保でき、また高温での取り扱い性も十分に得られる。この重合体の使用量は、15~350重量部がより好ましく、20~300重量部が特に好ましい。この場合、前記粘接着剤層の25℃における貯蔵弾性率が10~2000MPaとなるような組成比が好ましい。

【0028】熱可塑性樹脂としてポリイミド樹脂を使用する場合は、ポリイミド樹脂を100重量部、エポキシ樹脂及びエポキシ樹脂硬化剤を1~200重量部、より好ましくは10~150重量部、及びポリエーテル系ピスマレイミド酢酸エステルを0.1~200重量部である。この範囲にあると、ダイシング時のチップ飛びを抑え、かつ放射線照射後の良好なピックアップ性を確保で40き、また、ダイボンディング時の良好な接着性と高温での十分な取り扱い性を確保できる。

【0029】また、本発明の接着シートを形成する粘接着削層には、硬化促進剤を添加することもできる。硬化促進剤には、特に制限が無く、イミダゾール類、ジシアンジアミド誘導体、ジカルボン酸ジヒドラジド、トリフェニルホスフィン、テトラフェニルホスホニウムテトラフェニルボレート、2-エチル-4-メチルイミダゾールテトラフェニルボレート、1,8-ジアザビシクロ(5,4,0)ウンデセン-7-テトラフェニルボレー50

ト等を用いることができる。これらは単独でまたは2種類以上を組み合わせて使用することができる。

【0030】硬化促進剤の添加量は、エポキシ樹脂およびエポキシ樹脂硬化剤100重量部に対して、0.1~5重量部が好ましく、0.2~3重量部がより好ましい。添加量がこの範囲にあると、硬化性と保存安定性を両立することができる。

【0031】本発明の接着シートを形成する粘接着剤層には、可とう性や耐リフロークラック性を向上させる目的で、エポキシ樹脂と相溶性がある高分子量樹脂を添加することができる。このような高分子量樹脂としては、特に限定されず、たとえばフェノキシ樹脂、高分子量エポキシ樹脂、超高分子量エポキシ樹脂などが挙げられる。これらは、単独でまたは2種類以上を組み合わせて使用することもできる。エポキシ樹脂と相溶性がある高分子量樹脂の使用量は、エポキシ樹脂およびエポキシ樹脂硬化剤100重量部に対して、40重量部以下とすることが好ましい。この範囲であると、エポキシ樹脂層のTgを確保できる。

【0032】また、本発明の接着シートを形成する粘接着剤層には、その取り扱い性向上、熱伝導性向上、溶融粘度の調整およびチキソトロピック性付与などを目的として、無機フィラーを添加することもできる。無機フィラーとしては、特に制限はなく、例えば、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸ウム、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸マグネシウム、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、ほう酸アルミウイスカ、窒化アルミニウム、ほう酸アルミウイスカ、窒化ほう素、結晶性シリカ、非晶性シリカ等が挙げられ、フィラーの形状は特に制限されるものではない。これらのフィラーは単独で又は二種類以上を組み合わせて使用することができる。

【0033】中でも、熱伝導性向上のためには、酸化アルミニウム、窒化アルミニウム、窒化ほう素、結晶性シリカ、非晶性シリカ等が好ましい。また、溶融粘度の調整やチキソトロピック性の付与の目的には、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ケイ酸カルシウム、酸化アルミニウム、結晶性シリカ、非晶性シリカなどが好ましい。

【0034】無機フィラーの使用量は、粘接着剤層100重量部に対して1~20重量部が好ましい。1重量部未満だと添加効果が得られない傾向があり、20重量部を超えると、接着剤層の貯蔵弾性率の上昇、接着性の低下、ボイド残存による電気特性の低下等の問題を起こす傾向がある。

【0035】また、本発明の接着シートを形成する粘接着剤層には、異種材料間の界面結合を良くするために、各種カップリング剤を添加することもできる。カップリング剤としては、例えば、シラン系、チタン系、アルミ 10 ニウム系等が挙げられ、中でも効果が高い点でシラン系カップリング剤が好ましい。

【0036】上記シラン系カップリング剤としては、特 に制限はなく、例えば、ビニルトリクロルシラン、ビニ ルトリス(β -メトキシエトキシ)シラン、ビニルトリ エトキシシラン、ビニルトリメトキシシラン、ァーメタ クリロキシプロピルトリメトキシシラン、ァーメタクリ ロキシプロピルメチルジメトキシシラン、 β - (3, 4) -エポキシシクロヘキシル) エチルトリメトキシシラ ン、 γ - グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、 γ 20 -グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ-グリシドキシプロピルメチルジエトキシシラン、N-β(アミノエチル) ァーアミノプロピルトリメトキシシラ ン、N-β (アミノエチル) γ-アミノプロピルメチル ジメトキシシラン、ァーアミノプロピルトリエトキシシ ラン、N - フェニルーγーアミノプロピルトリメトキシ シラン、 ァーメルカプトプロピルトリメトキシシラン、 アーメルカプトプロピルトリエトキシシラン、3ーアミ ノプロピルメチルジエトキシシラン、3-ウレイドプロ ピルトリエトキシシラン、3-ウレイドプロピルトリメ 30 トキシシラン、3-アミノプロピルトリメトキシシラ ン、3-アミノプロピルートリス(2-メトキシーエト キシーエトキシ) シラン、N-メチル-3-アミノプロ ピルトリメトキシシラン、トリアミノプロピルトリメト キシシラン、3-4,5-ジヒドロイミダゾール-1-イループロピルトリメトキシシラン、3-メタクリロキ シプロピルートリメトキシシラン、3-メルカプトプロ ピルメチルジメトキシシラン、3-クロロプロピルメチ ルジメトキシシラン、3-クロロプロピルジメトキシシ ラン、3-シアノプロピルトリエトキシシラン、ヘキサ 40 メチルジシラザン、N, O-ビス(トリメチルシリル) アセトアミド、メチルトリメトキシシラン、メチルトリ エトキシシラン、エチルトリクロロシラン、n-プロピ ルトリメトキシシラン、イソブチルトリメトキシシラ ン、アミルトリクロロシラン、オクチルトリエトキシシ ラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエト キシシラン、メチルトリ(メタクリロイルオキエトキ シ) シラン、メチルトリ(グリシジルオキシ)シラン、 $N-\beta$ (N- $U=N^2$ $U=N^2$ U=ノプロピルトリメトキシシラン、オクタデシルジメチル 50

〔3-(トリメトキシシリル)プロピル〕アンモニウムクロライド、ァークロロプロピルメチルジクロロシラン、ァークロロプロピルメチルジメトキシシラン、ァークロロプロピルメチルジエトキシシラン、トリメチルシリルイソシアネート、ジメチルシリルイソシアネート、メチルシリルトリイソシアネート、ドニルシリルトリイソシアネート、テトライソシアネートシラン、エトキシシランイソシアネートなどを使用することができ、単独で又は二種類以上を組み合わせて使用することができる。

【0037】また、チタン系カップリング剤としては、 例えば、イソプロピルトリオクタノイルチタネート、イ ソプロピルジメタクリルイソステアロイルチタネート、 イソプロピルトリドデシルベンゼンスルホニルチタネー ト、イソプロピルイソステアロイルジアクリルチタネー ト、イソプロピルトリ(ジオクチルホスフェート)チタ ネート、イソプロピルトリクミルフェニルチタネート、 イソプロピルトリス (ジオクチルパイロホスフェート) チタネート、イソプロピルトリス(n - アミノエチル) チタネート、テトライソプロピルビス (ジオクチルホス ファイト) チタネート、テトラオクチルビス (ジトリデ シルホスファイト) チタネート、テトラ(2,2-ジア リルオキシメチル-1-ブチル) ビス (ジトリデシル) ホスファイトチタネート、ジクミルフェニルオキシアセ テートチタネート、ビス(ジオクチルパイ ロホスフェー ト) オキシアセテートチタネート、テトライソプロピル チタネート、テトラノルマルブチルチタネート、ブチル チタネートダイマー、テトラ(2-エチルヘキシル)チ タネート、チタンアセチルアセトネート、ポリチタンア エチルアセトネート、チタンオクチレングリコレート、 チタンラクテートアンモニウム塩、チタンラクテート、 チタンラクテートエチルエステル、チタンチリエタノー ルアミネート、ポリヒドロキシチタンステアレート、テ トラメチルオルソチタネート、テトラエチルオルソチタ ネート、テタラプロピルオルソチタネート、テトライソ ブチルオルソチタネート、ステアリルチタネート、クレ シルチタネートモノマー、クレシルチタネートポリマ ー、ジイソプロポキシービス(2,4-ペンタジオネー ト) チタニウム(IV)、ジイソプロピルービスートリ エタノールアミノチタネート、オクチレングリコールチ タネート、テトラー n ープトキシチタンポリマー、トリ -n-プトキシチタンモノステアレートポリマー、トリ - n - プトキシチタンモノステアレートなどを使用する ことができ、単独で又は二種類以上を組み合わせて使用 することができる。

【0038】アルミニウム系カップリング剤としては、例えば、エチルアセトアセテートアルミニウムジイソプロピレート、アルミニウムトイス(エチルアセトアセテート)、アルキルアセトアセテートアルミニウムジイソプロピレート、アルミニウムモノアセチルアセテートビ

ス (エチルアセトアセテート)、アルミニウムトリス (アセチルアセトネート)、アルミニウム=モノイソプ ロポキシモノオレオキシエチルアセトアセテート、アル

ロポキシモノオレオキシエチルアセトアセテート、アルミニウムージーnーブトキシドモノエチルアセトアセテート、アルミニウムージーisoープロポキシドーモノエチルアセトアセテート等のアルミニウムキレート化合物、アルミニウムイソプロピレート、モノーsecーブトキシアルミニウムジイソプロピレート、アルミニウムーsecーブチレート、アルミニウムエチレート等のアルミニウムアルコレートなどを使用することができ、単10独で又は二種類以上を組み合わせて使用することができ

【0039】上記カップリング剤の使用量は、その効果や耐熱性及びコストの面から、エポキシ樹脂およびエポキシ樹脂硬化剤100重量部に対して、0.01~10重量部とするのが好ましい。

【0040】本発明の接着シートを形成する粘接着剤層には、イオン性不純物を吸着して、吸湿時の絶縁信頼性をよくするために、さらにイオン捕捉剤を添加することもできる。このようなイオン捕捉剤としては、特に制限はなく、例えば、トリアジンチオール化合物、ビスフェノール系還元剤等の、銅がイオン化して溶け出すのを防止するため銅害防止剤として知られる化合物、ジルコニウム系、アンチモンビスマス系マグネシウムアルミニウム化合物等の無機イオン吸着剤などが挙げられる。上記イオン捕捉剤の使用量は、添加による効果や耐熱性、コスト等の点から、(A)エポキシ樹脂およびエポキシ樹脂硬化剤100重量部に対して、0.1~10重量部が好ましい。

【0041】本発明接着シートは、接着シートを形成す 30 る組成物を溶剤に溶解あるいは分散してワニスとし、基材フィルム上に塗布、加熱し溶剤を除去することによって得ることができる。本発明の接着シートに用いる基材としては、特に制限は無く、例えば、ポリテトラフルオロエチレンフィルム、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポイエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリメチルペンテンフィルム、ポリイミドフィルムなどのプラスチックフィルム等が挙げられる。

【0042】本発明の接着シートは、ダイシング工程終了後、紫外線(UV)あるいは電子線(EB)などの放40射線を接着シートに照射し、放射線重合性を有する接着シートを重合硬化せしめ、接着シートと基材界面の接着力を低下させて半導体素子のピックアップを可能にするものである。従来の接着シートの場合、基材の表面張力が40mN/mを超えると、接着シートと基材界面の接着力の低下が充分でなく、ピックアップ性に劣る傾向があった。しかし、本発明の接着シートは、基材の表面張力が40mN/mを超えていても、紫外線(UV)あるいは電子線(EB)などの放射線照射後に、接着シートと基材界面の接着力が充分に低下し、半導体素子のピッ50

クアップが良好になる。したがって、従来は、基材の表面張力が40mN/m以下にするために、使用する基材フィルムに表面処理をしていたが、本発明の接着シートでは、基材フィルムを表面処理する必要がなく、コスト的にも有利になる。

【0043】本発明において照射する放射線は、150~750n mの波長域を持つ活性光線であり、紫外線、遠紫外線、近紫外線、可視光線、電子線、赤外線、近赤外線などがある。例えば、低圧水銀灯、中圧水銀灯、高圧水銀灯、超高圧水銀灯、キセノンランプ、メタルハライドランプを使用して0.01~10000 J/c m^{\prime} で照射することができる。

【0044】また、上記のワニス化するための溶剤としては、特に限定されないが、フィルム作製時の揮発性などを考慮すると、たとえば、メタノール、エタノール、2ーメトキシエタノール、2ーエトキシエタノール、2ーブトキシエタノール、メチルエチルケトン、アセトン、メチルイソブチルケトン、トルエン、キシレンなどの比較的低沸点の溶媒を使用するのが好ましい。また、塗膜性を向上させるなどの目的で、たとえば、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、Nーメチルピロリドン、シクロヘキサノンなどの比較的高沸点の溶媒を使用することもできる。これらの溶媒は、単独でまたは2種類以上を組み合わせて使用することができる。

【0045】無機フィラーを添加した際のワニスの製造には、無機フィラーの分散性を考慮して、らいかい機、3本ロール、ポールミル及びビーズミルなどを使用するのが好ましく、また、これらを組み合わせて使用することもできる。また、無機フィラーと低分子量の原料をあらかじめ混合した後、高分子量の原料を配合することによって、混合する時間を短縮することもできる。また、ワニスとした後、真空脱気等によってワニス中の気泡を除去することもできる。基材フィルムへのワニスの塗布方法としては、公知の方法を用いることができ、例えば、ナイフコート法、ロールコート法、スプレーコート法、グラビアコート法、バーコート法、カーテンコート法、グラビアコート法、バーコート法、カーテンコート法、グラビアコート法、バーコート法、カーテンコート法等が挙げられる。

【0046】接着シートの厚みは、特に制限はないが、 粘接着剤層、基材ともに $5\sim250\,\mu$ mが好ましい。 $5\,\mu$ mより薄いと応力緩和効果が乏しくなる傾向があり、 $250\,\mu$ mより厚いと経済的でなくなる上に、半導体装置の小型化の要求に応えられない。

【0047】また、本発明の接着シートは、所望のシート厚を得るために、さらに1又は2以上の接着剤層又は 粘接着剤層を半導体ウェハと粘接着剤層との間に挟むように設けてもよい。この場合、前記所望により設けられる粘接着剤層として、前記の方法によって調製されたものの他に、従来公知の方法によって調製されたものを用いることができる。前記所望により設けられる粘接着剤 層として、商業的に入手可能な接着シート、例えば、ポ

リイミド系、シリコンオリゴマー系、ゴム-エポキシ系、エポキシ系接着剤を用いることができる。但し、粘接着剤層同士の剥離が発生しないような貼り合わせ条件を従来公知の技術に基づいて考慮する必要がある。

【0048】以上説明したような構成を有する接着シートに放射線を照射すると、放射線照射後には粘接着剤層の基材層に対する接着力が大きく低下することとなる。そのため、後に説明するように半導体装置を製造する際のダイシング工程において本発明の接着シートを用いることにより、粘接着剤層と、基材層とが容易に剥離する 10こととなる結果、粘接着剤層を付した半導体素子を好適にピックアップすることができる。

[0049] 本発明の接着シートの粘接着剤層は、放射線照射のみで基材の接着力を低下させる方法以外に放射線照射と同時あるいは放射線照射後に硬化反応を促進する目的で加熱を併用しても良い。加熱を併用することにより、より低温短時間での接着力低下が可能となる。加熱温度は、粘接着剤層の分解点以下であれば特に制限は受けないが、50~170℃の温度が好ましい。

【0050】続いて、本発明に係る接着シートの使用方 20 法について、図1~図8を参照しながら説明するが、本 発明の使用方法が以下の方法に限定されないことはいう までもない。尚、図中同一の機能を有するものについて は同一の符号を付してその説明を省略する。 図1には基 材フィルム1と粘接着剤層2とを備える接着シート10 が開示されており、図2には前記構成要件に加えてさら に剥離性シート3を備える接着シート11が開示されて いる。これらの接着シート10、11をダイシングテー プとして使用する場合、まず接着シート10、11の粘 接着剤層2とウェハ表面が密着するようにして所定の作 30 業台上に載置する。本発明に係る接着シートの上面に剥 離性シート3が設けられている場合には、該シート3を 剥離除去した後に、接着シートの粘接着剤層 2 を上向き にして所定の作業台上に載置する。次に、図3に示すよ うにして、この粘接着剤層2の上面にダイシング加工す べき半導体ウェハAを貼着する。この際、前述のよう に、所望のシート厚を得るためにさらに1又は2以上の 接着剤層又は粘接着剤層を半導体ウェハAと粘接着剤層 2との間に挟むように設けてもよい。続いて、この貼着 状態で半導体ウェハAにダイシング、洗浄、乾燥の工程 40 が加えられる。この際、粘接着剤層2により半導体ウェ ハAは接着シートに充分に粘着保持されているので、上 記各工程の間に半導体ウェハAが脱落することはない。 尚、図4にはダイシングカッター6を用いてウェハAを ダイシングすることにより半導体素子A1、A2、A3 が得られることが示されている。次に、図5に示すよう に、放射線Bを接着シートの粘接着剤層2に照射し、放 射線重合性を有する接着シートの一部又は大部分を重合 硬化せしめる。この際、放射線照射と同時あるいは放射 **線照射後に硬化反応を促進する目的で加熱を併用しても 50**

良い。加熱を併用することにより、より低温短時間での 接着力低下が可能となる。加熱温度は、粘接着剤層の熱 分解温度以下であれば特に制限は受けないが、50~1 70℃の温度が好ましい。接着シートへの放射線照射 は、図5中矢印Bで示されるように基材フィルム1の粘 接着剤層2が設けられていない面から行う。したがって 前述のように、放射線としてUVを用いる場合には基材 フィルム1は光透過性であることが必要であるが、放射 線としてEBを用いる場合には基材フィルム2は必ずし も光透過性である必要はない。放射線照射後、図6に示 されるようにしてピックアップすべき半導体素子A1、 A2、A3を例えば吸引コレット4によりピックアップ する。この際、吸引コレット4に換えて又は吸引コレッ ト4と併用するようにして、ピックアップすべき半導体 素子A1、A2、A3を基材フィルム1の下面から、例 えば針扞等により突き上げることもできる。半導体素子 A1と粘接着剤層2との間の粘着力は、粘接着剤層2と 基材フィルム1との間の粘着力よりも大きいため、半導 体素子A1のピックアップを行うと、粘接着剤層2は半 導体素子A1の下面に付着した状態で剥離する(図7参 照)。次いで、半導体素子A1、A2、A3を粘接着剤 層 2 を介し て半導体素子搭 載用支持部材 5 に載置し加熱 する。加熱により粘接着剤層2は接着力が発現し、半導 体素子A1、A2、A3と半導体素子搭載用支持部材5 との接着が完了する(図8参照)。

[0051]

【実施例】以下、本発明を実施例を用いてより詳細に説 明する。本発明は、これらに限定されるものではない。 【0052】 (実施例1) YDCN-703 (東都化成 (株) 製商品名、o-クレゾールノボラック型エポキシ 樹脂、エポキシ当量210)42.3重量部、プライオ ーフェンLF2882(大日本インキ化学工業(株)製 商品名、ビスフェノールAノボラック樹脂)23.9重 量部、HTR-860P-3(帝国化学産業(株)製商 品名、エポキシ基含有アクリルゴム、分子量80万、T g-7℃) 44. 1重量部、キュアゾール2PZ-CN (四国化成工業(株)製商品名、1-シアノエチルー2 -フェニルイミダゾール) 0.4重量部、NUC A-187 (日本ユニカー(株)製商品名、 γ - グリシドキ シプロピルトリメトキシシラン) 0. 7重量部、ルミキ ュアMIA200(大日本インキ化学工業(株)製商品 名、ポリエーテル系ピスマレイミド酢酸エステル)20 重量部からなる組成物に、メチルエチルケトンを加えて 攪拌混合し、真空脱気した。この接着剤ワニスを、厚さ 50μmのポリエチレンテレフタレート(帝人デュポン フィルム (株) 製、テイジンテトロンフィルムG2-5 0) 上に塗布し、140℃で5分間加熱乾燥して、基材 を備えた膜厚が50μmの接着シート1 (基材を除いた 粘接着剤層の厚みが50μm)を得た。

【0053】 (実施例2) 温度計、攪拌機及び塩化カル

シウム管を備えた500mlフラスコに、1,12-ジ アミノドデカン5. 41g(0.045モル)、エーテ ルジアミン(BASF製、エーテルジアミン2000(分子 量:1923))11.54g(0.01モル)、ポリ シロキサンジアミン(信越シリコーン製、KF-801 0 (分子量: 900)) 24. 3g(0.045モル) 及びN-メチル-2-ピロリドン169gを仕込み提拌 した。ジアミンの溶解後、フラスコを氷浴中で冷却しな がら、4,4'-(4,4'-イソプロピリデンジフェ ノキシ) ビス (フタル酸二無水物) 31.23g (0. 1モル)を少量ずつ添加した。室温で8時間反応させた のち、キシレン112.7gを加え、窒素ガスを吹き込 みながら180℃で加熱し、水と共にキシレンを共沸除 去し、ポリイミド溶液を得た(樹脂分:33重量%)。 樹脂分50g分の前記ポリイミド溶液に、o-クレゾー ルノボラック型エポキシ樹脂 (日本化薬(株)製、商品 名:ESCN-195) 13g、フェノールノボラック 樹脂(明和化成(株)製、商品名:H-1) 6.9g、 テトラフェニルホシホニウムテトラフェニルポラート (北興化学 (株) 製、商品名: TPPK) 0.13g、 ルミキュアMIA200 (大日本インキ化学工業 (株) 製商品名、ポリエーテル系ビスマレイミド酢酸エステ ル) 20gを、溶剤であるN-メチル-2-ピロリドン 100 g中に加えて溶解させる。これを良く攪拌し、均 一に分散させて接着剤ワニスを得た。この接着剤ワニス を、厚さ50μmのポリエチレンテレフタレート(帝人 デュポンフィルム (株) 製、テイジンテトロンフィル ム:G2-50)上に塗布し、150℃で30分間加熱 乾燥して、基材(ポリエチレンテレフタレートフィル ム)を備えた膜厚が50μmの接着シート2 (基材を除 30 いた接着シートの厚みが50μm)を得た。

【0054】 (実施例3) 温度計、攪拌機及び塩化カル シウム管を備えた500mlフラスコに、攪拌装置、窒 素導入管、乾燥管を備えた1リットルの四つ口のフラス コに、2,2-ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フ ェニル)プロパン8.2g(0.02モル)及びポリシ ロキサンジアミン(信越シリコーン製、KF-8010 (分子量:900)) 72.0g(0.08モル)を入 れ、窒素気流下、N-メチル-2-ピロリドン320g を加えて溶液とした。フラスコを水浴上に移し、激しく 40 **投**拌しながら 4, 4'-(4-4'-イソプロピリデン ジフェノキシ) - ビス (フタル酸二無水物) 52.0g (0.10モル)を少量ずつ加えた。酸二無水物がほぼ 溶解したら、ゆっくりと撹拌しながら6時間反応させ、 ポリアミド酸溶液を得た。次に、前記のポリアミド酸溶 液が入った四つロフラスコに蒸留装置を装着し、キシレ ン210gを加えた。窒素気流下、180℃の油浴上 で、激しく攪拌しながら、イミド化により生成する縮合 水をキシレンと共に共沸留去した。その反応液を水中に 注ぎ、沈殿したポリマーを遺別、乾燥してポリイミド樹 50 脂を得た。このポリイミド樹脂50g、0-クレゾール ノボラック 型エポキシ樹脂 (日本化薬(株)製、商品 名:ESCN-195) 13g、フェノールノボラック 樹脂 (明和化成 (株) 製、商品名:H-1) 6.9g、 テトラフェニルホシホニウムテトラフェニルボラート (北與化学 (株) 製、商品名: TPPK) 0. 13g、 ルミキュアMIA200(大日本インキ化学工業(株) 製商品名、ポリエーテル系ピスマレイミド酢酸エステ ル) 20gを、溶剤であるN-メチル-2-ピロリドン 200g中に加えて溶解させる。これを良く攪拌し、均 一に分散させて接着剤ワニスを得た。この接着剤ワニス を、厚さ50μmのポリエチレンテレフタレート(帝人 デュポンフィルム(株)製、テイジンテトロンフィル ム: G2-50) 上に塗布し、150℃で30分間加熱 乾燥して、基材(ポリエチレンテレフタレートフィル ム) を備えた膜厚が50μmの接着シート3(基材を除 いた接着シートの厚みが50μm)を得た。

【0055】(比較例1) YDCN-703 (東都化成 (株) 製商品名、o-クレゾールノボラック型エポキシ 樹脂、エポキシ当量210)42.3重量部、プライオ ーフェンL F 2 8 8 2 (大日本インキ化学工業 (株) 製 商品名、ピスフェノールAノボラック樹脂) 23.9重 量部、HTR-600LBDR(帝国化学産業(株)製 商品名、アクリルゴム、分子量120万以上、Tg-4 2℃) 44. 1重量部、キュアゾール2PZ-CN(四 国化成工業(株)製商品名、1-シアノエチルー2-フ ェニルイミダゾール) 0. 4重量部、NUC A-18 7 (日本ユニカー (株) 製商品名、 γ - グリシドキシプ ロピルトリメトキシシラン) 0.7重量部、4G(新中 村化学(株)製商品名、テトラエチレングリコールジメ タクリレート)22.05重量部及び1-ヒドロキシシ クロヘキシルフェニルケトン0.5重量部からなる組成 物に、メチルエチルケトンを加えて撹拌混合し、真空脱 気した。この接着剤ワニスを、厚さ50μmのポリエチ レンテレフタレート(帝人デュポンフィルム(株)製、 テイジンテトロンフィルムG2-50)上に塗布し、1 40℃で5分間加熱乾燥して、基材を備えた膜厚が50 μmの接着シート4 (基材を除いた粘接着剤層の厚みが 50 μm) を得た。

【0056】(比較例2) 提拌装置、窒素導入管、乾燥管を備えた1リットルの四つ口のフラスコに、2,2-ビス(4-(4-アミノフェノキシ)フェニル)プロパン41.0g(0.10モル)を入れ、窒素気流下、Nーメチル-2-ピロリドン250gを加えて溶液とした。フラスコを水浴上に移し、激しく提拌しながら1,2-(エチレン)ビス(トリメリテートニ無水物)41.0g(0.10モル)を少量ずつ加えた。酸二無水物がほぼ溶解したら、ゆっくりと提拌しながら6時間反応させ、ポリアミド酸溶液を得た。次に、前記のポリアミド酸溶液が入った四つロフラスコに蒸留装置を装着

し、キシレン220gを加えた。窒素気流下、180℃ の油浴上で、激しく攪拌しながら、イミド化により生成 する縮合水をキシレンと共に共沸留去した。その反応液 を水中に注ぎ、沈殿したポリマーを濾別、乾燥してポリ イミド樹脂を得た。このポリイミド樹脂50g、ローク レゾールノボラック型エポキシ樹脂(日本化薬(株) 製、商品名: ESCN-195) 13g、フェノールノ ボラック樹脂 (明和化成(株) 製、商品名:H-1) 6.9g、テトラフェニルホシホニウムテトラフェニル ボラート(北興化学(株)製、商品名: TPPK) 0. 13gを、溶剤であるN-メチル-2-ピロリドン20 0g中に加えて溶解させる。これを良く攪拌し、均一に 分散させて接着剤ワニスを得た。この接着剤ワニスを、 厚さ50μmのポリエチレンテレフタレート (帝人デュ ポンフィルム (株) 製、テイジンテトロンフィルム: G 2-50) 上に塗布し、150℃で30分間加熱乾燥し て、基材(ポリエチレンテレフタレートフィルム)を備 えた膜厚が50μmの接着シート5(基材を除いた接着 シートの厚みが50μm)を得た。

【0057】得られた接着シート1を用いて、半導体チップと厚み25μmのポリイミドフィルムを基材に用いた配線基板を接着シートで貼り合せた半導体装置サンプル(片面にはんだボールを形成)を作製し、耐熱性及び耐湿性を調べた。耐熱性の評価方法には、耐リフロークラック性と温度サイクル試験を適用した。耐リフロークラック性の評価は、サンプル表面の最高温度が240℃でこの温度を20秒間保持するように温度設定したIRリフロー炉にサンプルを通し、室温で放置することにより冷却する処理を2回繰り返したサンプル中のクラック

* いないものを○とし、発生していたものを×とした。耐温度サイクル性は、サンプルを-55℃雰囲気に30分間放置し、その後125℃の雰囲気に30分間放置する工程を1サイクルとして、1000サイクル後において超音波顕微鏡を用いて剥離やクラック等の破壊が発生していないものを○、発生したものを×とした。また、耐湿性評価は、温度121℃、湿度100%、2.03×10°Paの雰囲気(プレッシャークッカーテスト:PCT処理)で72時間処理後に剥離を観察した。剥離の10 認められなかったものを○とし、剥離のあったものを×とした。

【0058】一方、接着シート1を厚さ 150μ mのシリコンウェハ上に貼付け、接着シート付きシリコンウェハをダイシング装置上に載置した。次いで、半導体ウェハをダイシング装置上に固定して100mm/secの速度で5mm×5mmにダイシングした後、(株)オーク製作所製 UV-330 HQP-2型露光機を使用して、500mJ/cm²の露光量で接着シートの支持体フィルム側から露光し、ピックアップ装置にてダイシングしたチップをピックアップし、ダイシング時のチップ飛び及びピックアップ性を評価した。

【0059】さらに、上記接着シート付きシリコンウェハに $500 \, \mathrm{mJ/cm^2}$ の露光量で接着シートの支持体フィルム側から露光し、露光前後の接着シート/基材界面の接着強度を、 $90 \, \mathrm{e}$ ピール強度で測定した(引張り速度 $50 \, \mathrm{m/min}$)。これらの評価結果をまとめて表1に示す。

[0060]

【表1】

を目視と超音波顕微鏡で視察した。クラックの発生して*30

表1							
項目		実施例1	実施例 2	実施例 3	比較例1	比較例2	
接着シート		1	2	3	4	5	
耐熱性	耐リフロークラッ ク性		0	0	0	×	0
	耐温度	ナイクル性	0	0	0	×	0
耐湿性		0	0	0	×	0	
ダイシング時のチップ飛び		無	無	無	無	無	
ピックアップ性		100	100	100	100	0	
ビール強度 露光前		4000	4000	4000	4000	4000	
(mN/cm) 露光後		80	8 5	90	6.5	4000	

【0061】表1から、本発明の接着シートは耐熱性および耐湿性に優れ、ダイシング時のチップ飛びもなく、ピックアップ性も良好である。さらに、露光前後の接着強度差が大きいため、作業条件の許容度が大きいため、作業条件の許容度が大きく、作業性に優れるものである。

[0062]

【発明の効果】本発明の接着シートは、ダイシング工程ではダイシングテープとして、半導体素子と支持部材の 50

接合工程では接続信頼性に優れる接着剤として使用することができ、また、半導体搭載用支持部材に熱膨張係数の差が大きい半導体素子を実装する場合に必要な耐熱性、耐湿性を有し、かつ作業性に優れるものである。また、本発明の接着シートを使用した半導体装置の製造方法は、製造工程を簡略化でき、しかも製造した半導体装置は、半導体搭載用支持部材に熱膨張係数の差が大きい半導体素子を実装する場合に必要な耐熱性、耐湿性および作業性を兼ね備えるものである。

DEST AVAILABLE COPY

(14)

25

特開 2 0 0 3 - 3 2 7 9 2 5 26

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る接**党シートの一例の断面図であ** る。

【図2】本発明に係る接 かートの別の例の断面図である。

【図3】本発明に係る接着シートに半導体ウェハを貼着した状態を示す。

【図4】本発明に係る接着シートを半導体ウェハのダイシング工程に用いた場合の説明図である。

【図5】図4に示す工程の後、接着シートに、裏面から 10 放射線を照射した状態を示す。

【図6】図5に示す工程の後、半導体素子をピックアップする工程を示す。

【図7】ピックアップされた半導体素子と粘接着剤層を*

* 示す。

【符号の説明】

1…基材フィルム

2…粘接着剤層

3…剥離性 シート

4…吸引コレット

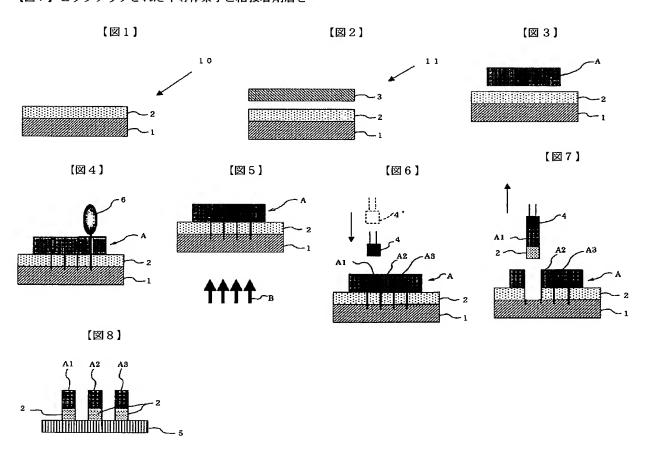
5 … 半導体 素子搭載用支持 部材

10、11…接着シート

A···半導体ウェハ

A1、A2、A3···半導体素子

B…放射線



フロントページの続き

(51) Int. C1. ⁷

識別記号

FΙ

. .

テーマコード(参考)

H 0 1 L 21/301 21/52 H 0 1 L 21/52 21/78 E M (72) 発明者 川上 広幸

茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式

会社総合研究所内

(72)発明者 稲田 禎一

茨城県つくば市和台48 日立化成工業株式

会社総合研究所内

Fターム(参考) 4J004 AA10 AA11 AA13 AB06 BA02

FA05

4J040 DG002 EC001 EE012 EH031

JA09 JB07 LA01 NA20

5F047 BA22 BA23 BA24 BA33 BA37

BB03 BB19